

01;04;10

©1994 г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА (η, ϵ) -ДИАГРАММ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ БУРСИАНА

В.И.Кузнецов, А.В.Соловьев, А.Я.Эндер

Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН,

194021, Санкт-Петербург, Россия

(Поступило в Редакцию 27 февраля 1994 г.)

Используется техника (η, ϵ) -диаграмм для изучения вакуумного диода с моноэнергетическим потоком электронов. Состояния такого диода при нулевой разности потенциалов между электродами теоретически изучались Бурсианом и Павловым в 1923 г. [1]. Было обнаружено существование нескольких стационарных решений задачи.

Проведена полная классификация стационарных распределений потенциала в зависимости от внешнего напряжения и величины межэлектродного зазора. Получены аналитические выражения для всех типов распределений потенциала. Построены (η, ϵ) -диаграммы и вольт-амперные характеристики. Найдены значения параметров, для которых возможны несколько распределений потенциала при одном внешнем напряжении.

Введение

В [1] была решена задача о распределении потенциала при прохождении электронного пучка между двумя эквипотенциальными сетками. Один из чрезвычайно интересных результатов этой работы состоит в том, что при одних и тех же внешних параметрах можно найти несколько различных режимов прохождения электронного пучка — несколько самосогласованных распределений потенциала, удовлетворяющих одним граничным условиям.

В [1] задача формулировалась следующим образом. С плоского электрода, помещенного в начало координат (в дальнейшем будем называть его эмиттером), поступает одномерный поток электронов, представляющий собой пучок с энергией частиц, много большей их теплового разброса, и движется по направлению ко второму электроду (будем называть его коллектором), расположенному на расстоянии L параллельно эмиттеру. Потенциалы эмиттера и коллектора полагаются одинаковыми и равными нулю. Для удобства представления результатов [1] перейдем к безразмерным величинам, используя принятые в

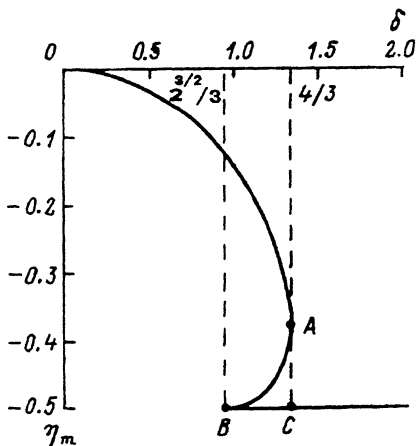


Рис. 1. Зависимость минимального значения на распределении потенциала η_m от величины межэлектродного зазора δ при нулевой разности потенциалов между электродами.

настоящее время при изучении пучков в плазме характерные энергию и длину,

$$W = mv_0^2, \quad \lambda_D = \left(\frac{W}{4\pi e^2 n_0} \right)^{1/2}, \quad (1)$$

где m , e , v_0 , n_0 — масса и заряд электрона, скорость и концентрация электронов у эмиттера соответственно.

Тогда безразмерные потенциал, координата и расстояние между электродами будут равны соответственно

$$\eta = e\Phi/W, \quad x = z/\lambda_D, \quad \delta = L/\lambda_D. \quad (2)$$

Отметим, что в [1] характерная энергия выбиралась равной $W/2$, а характерная длина — $\lambda_D/2^{3/2}$.

Режим прохождения электронного пучка характеризуется единственным параметром δ (в [1] использовался безразмерный параметр, численно равный $2\delta^2$).

Ясно, что, для того чтобы удовлетворить нулевым граничным условиям на электродах, потенциал должен иметь минимум η_m в одной из внутренних точек промежутка $(0, L)$. Зависимость η_m от параметра δ (рис. 1) дает возможность определить число решений: при δ , лежащих в интервалах $(0, 2^{3/2}/3)$ и $(4/3, \infty)$, реализуется только одно распределение потенциала, в то время как при $\delta \in 2^{3/2}/3, 4/3$ могут существовать сразу три различных распределения потенциала.

Особо отметим решения с $\eta_m = -1/2$, где в точке минимума потенциала потенциальная энергия электронов совпадает с их начальной кинетической энергией $mv_0^2/2$, т.е. скорость электронов обращается в нуль. Авторы [1] строят такие решения, вводя модель частичного отражения. Дело в том, что при расчете распределений потенциала с $\eta_m = -1/2$ необходимо учитывать, что электроны пучка имеют разброс по скоростям (хотя бы и очень малый). Тогда при бесконечно малом изменении потенциала η_m вблизи значения $-1/2$ отношение потоков прошедших и отраженных электронов будет изменяться и, варьируя это отношение, можно получить все решения с частичным отражением.

При увеличении параметра δ , например, путем увеличения плотности тока пучка в момент достижения им значения $4/3$ величина η_m изменяется скачком: режим без отражения электронного пучка (рис. 1, точка A) сменяется режимом с его частичным отражением (точка C'). Этот скачок происходит вследствие развития неустойчивости, получившей название неустойчивости Бурсиана. В [1] отмечалось, что решения на участке AB (рис. 1) не являются устойчивыми.

Результаты [1] обсуждались в работах [2,3]. В [2], кроме того, проведен анализ устойчивости решений с полным прохождением пучка. Рассмотрение в [2], носит качественный характер, так как делается предположение о постоянстве заряда пучка во всем межэлектродном зазоре.

В настоящей работе с помощью техники (η, ε) -диаграмм исследуются состояния вакуумного диода с моноэнергетическим пучком электронов, причем в отличие от [1] разность потенциалов V между электродами не полагается равной нулю, а является варьируемым параметром. Ранее (η, ε) -диаграммы применялись для изучения состояний плазмы в модели Пирса и в кнудсеновском диоде с поверхностной ионизацией (КДПИ) [4-7]. Задача данной работы — изучить, при каких δ и V возникают неединственные решения, и найти значения параметров, при которых развивается неустойчивость Бурсиана.

1. Основные уравнения. Решение для полупространства

Будем искать стационарные самосогласованные распределения потенциала, которые могут возникнуть в диоде при распространении одномерного электронного потока. Для предварительного анализа в этом разделе будем считать, что коллектор располагается на бесконечном расстоянии от эмиттера, и рассматривать задачу для полупространства.

Используя (2), введем безразмерные время, скорость, концентрацию и напряженность электрического поля: $\tau = tv_0/\lambda_D$, $u = v/v_0 = dx/d\tau$, $\rho = n/n_0$, $\varepsilon = eE\lambda_D/W = -\partial\eta/\partial x$. Обозначим через ε_0 напряженность электрического поля на эмиттере. В зависимости от значения этого параметра могут реализовываться распределения потенциала различного типа. Очевидно, что при больших отрицательных ε_0 потенциал монотонно возрастает с ростом x . При больших положительных ε_0 потенциал монотонно убывает до $-\infty$, при этом электроны долетают только до точки с потенциалом $-1/2$, т.е. происходит полное отражение. В определенном интервале ε_0 реализуются распределения потенциала, при которых происходит частичное отражение электронного потока.

Стационарные состояния диода описываются системой, состоящей из трех уравнений: уравнения Пуассона, условия постоянства потока и уравнения движения Ньютона. В одномерном случае с учетом возможного отражения электронов эти уравнения имеют вид:

$$\frac{\partial \varepsilon(x)}{\partial x} = -\rho(x), \quad (3a)$$

$$\rho(x)u(x) = \nu(x), \quad (3b)$$

$$\frac{d^2 x}{d\tau^2} = -\varepsilon(x). \quad (3в)$$

Безразмерный поток $\nu(x)$ определяется следующим образом:

$$\nu = (1 + r) \cdot \Theta(x_1 - x) + (1 - r) \cdot \Theta(x - x_1), \quad (4)$$

где r — коэффициент отражения, представляющий собой долю электронного потока, возвращающегося на эмиттер ($0 \leq r \leq 1$); x_1 — координата точки отражения; Θ — функция скачка Хевисайда.

Для режимов без отражения поток постоянен, $\nu \equiv 1$. Связь между потенциалом η и скоростью u находится из закона сохранения энергии

$$\eta = (u^2 - 1) / 2. \quad (5)$$

Если речь идет о построении стационарного решения, то уравнение (5) эквивалентно (3в), поскольку оно дает необходимую для замыкания системы уравнений (3) связь между скоростью и потенциалом. В отличие от нестационарного случая здесь нет необходимости вычислять зависимость координаты от времени для каждого электрона, т.е. решать уравнение (3в). Однако при анализе решений часто оказывается удобным использовать дополнительный параметр τ — время пролета электрона от эмиттера до рассматриваемой точки. Такой подход использовался в [8] для исследования модели Пирса. Уравнение для определения траектории электрона, движущегося по направлению к коллектору, получается после дифференцирования (3) по τ с учетом того, что в стационарном поле $d\varepsilon/d\tau = u \cdot \partial\varepsilon/\partial x$,

$$\frac{d^3 x}{d\tau^3} = \nu(x). \quad (6)$$

При заданном ε_0 имеем следующие начальные условия для (6):

$$x|_{\tau=0} = 0, \quad \left(\frac{dx}{d\tau}\right)_{\tau=0} = 1, \quad \left(\frac{d^2 x}{d\tau^2}\right)_{\tau=0} = -\varepsilon_0. \quad (7)$$

Остановимся на наиболее общем случае, когда имеет место частичное отражение электронов. Пусть τ_1 — время пролета электрона до точки отражения. При $\tau < \tau_1$ величина ν постоянна и из (6), (7) с использованием (3в) легко получаем

$$x = \frac{1+r}{6} \tau^3 - \frac{\varepsilon_0}{2} \tau^2 + \tau, \quad (8)$$

$$u = \frac{1+r}{2} \tau^2 - \varepsilon_0 \tau + 1, \quad (9)$$

$$\varepsilon = \varepsilon_0 - (1+r)\tau. \quad (10)$$

В точке отражения скорость равна нулю, а потенциал равен $-1/2$. При частичном отражении этот потенциал должен быть минимальным, поскольку существование точки с меньшим потенциалом привело бы к

полному отражению. Следовательно, напряженность электрического поля в точке отражения должна обращаться в нуль. Таким образом, имеем

$$u(\tau_1) = 0, \quad \varepsilon(\tau_1) = 0. \quad (11), (12)$$

Из (9), (10) и условий (11), (12) находим τ_1 и ε_0

$$\tau_1 = \left(\frac{2}{1+r} \right)^{1/2}, \quad (13)$$

$$\varepsilon_0(r) = [2(1+r)]^{1/2}. \quad (14)$$

Подставляя (13), (14) в (8), находим координату точки отражения

$$x_1(r) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{1+r} \right)^{1/2} \quad (15)$$

Используя условия (11), (12), для тех электронов, которые смогли преодолеть потенциальный барьер, можно получить решение (6) правее точки отражения ($\tau > \tau_1$)

$$x = x_1 + \frac{(\tau - \tau_1)^3}{6} (1-r). \quad (16)$$

Для u и ε тогда имеем

$$u = \frac{(\tau - \tau_1)^2}{2} (1-r), \quad (17)$$

$$\varepsilon = (\tau - \tau_1)(1-r). \quad (18)$$

Исключая τ из уравнений (16), (17) и используя (5), для потенциала правее точки отражения ($x \geq x_1$) получаем

$$\eta = 2 \left(\frac{3}{4} \right)^{4/3} \left[x - \frac{1}{3} \left(\frac{2}{2-j} \right)^{1/2} \right]^{4/3} j^{2/3} - \frac{1}{2}. \quad (19)$$

Здесь $j = 1 - r$ — безразмерная плотность тока, т.е. доля электронного потока, прошедшего за точку отражения. Учитывая (14), находим связь между j и ε_0

$$j = 2 - \varepsilon_0^2/2. \quad (20)$$

Как видно из (14), режиму частичного отражения соответствует интервал $2^{1/2} \leq \varepsilon_0 \leq 2$ (распределения потенциала 1-5 на рис. 2,6).

При $\varepsilon_0 \in (-\infty, 2^{1/2})$ реализуются решения без отражения. Действительно, полагая в (9) $r = 0$, убеждаемся, что для таких ε_0 скорость электрона неотрицательна при всех $\tau > 0$. Формулы (8)-(10) при $r = 0$

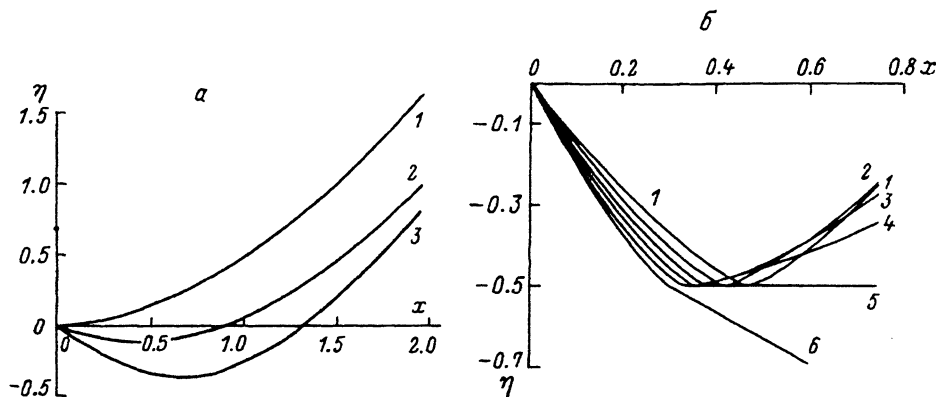


Рис. 2. Примеры распределений потенциала в режиме без отражения электронного потока (а) и с отражением (б).

а: 1 — $\varepsilon_0 = 0$, 2 — 0.5, 3 — 1.0; б: 1 — $r = 0$, 2 — 0.25, 3 — 0.5, 4 — 0.75, 5 — 1.0 (частичное отражение), 6 — $\varepsilon_0 = 2.1$ (полное отражение).

описывают как монотонные ($\varepsilon_0 \leq 0$) (рис. 2,а, кривая 1), так и немонотонные ($0 < \varepsilon_0 \leq 2^{1/2}$) распределения потенциала без отражения электронов (рис. 2,а, кривые 2 и 3).

При $\varepsilon_0 \geq 2$ происходит полное отражение электронного потока (распределение потенциала б на рис. 2,а). В этом случае потенциал в точке отражения не является минимальным и выполнения условия (12) требовать не надо. Полагая в (8)–(10) $r = 1$ и используя (11), находим τ_1 , x_1 и напряженность электрического поля в точке отражения — ε_1

$$\tau_1 = \frac{\varepsilon_0}{2} - \left[\left(\frac{\varepsilon_0}{2} \right)^2 - 1 \right]^{1/2} \quad (21)$$

$$x_1 = \frac{\varepsilon_0}{2} - \frac{2}{3} \left\{ \left(\frac{\varepsilon_0}{2} \right)^3 - \left[\left(\frac{\varepsilon_0}{2} \right)^2 - 1 \right]^{3/2} \right\}, \quad (22)$$

$$\varepsilon_1 = (\varepsilon_0^2 - 4)^{1/2} \quad (23)$$

В данном случае концентрация частиц правее точки отражения равна нулю. Поэтому при $x \geq x_1$ напряженность электрического поля остается постоянной и потенциал η равен

$$\eta(x) = -\frac{1}{2} - \varepsilon_1(x - x_1). \quad (24)$$

Рассмотрим, в каких пределах изменяется координата точки отражения x_1 . Введем следующие обозначения: $\delta_1 = 1/3$, $\delta_2 = 2^{1/2}/3$. Используя формулы (22) и (15), можно показать, что при полном отражении $x_1 \leq \delta_1$, а в режиме частичного отражения $\delta_1 < x_1(r) < \delta_2$. Отметим, что во всех случаях x_1 убывает с ростом ε_0 .

2. Построение (η, ε) -диаграмм

Пусть теперь на расстоянии δ от эмиттера расположен второй электрод — коллектор. Для изучения состояний такого диода удобно использовать (η, ε) -диаграмму. В общем случае в плоском плазменном диоде при заданном распределении ионов по зазору каждому значению ε_0 отвечает определенное распределение потенциала. На этом распределении можно найти потенциал на расстоянии δ от эмиттера η_δ . Зависимость η_δ от ε_0 называется (η, ε) -диаграммой.

В [5,6,9-12] (η, ε) -диаграмма использовалась для изучения модели Пирса в КДПИ. В модели Пирса пучок электронов распространяется через фон однородно распределенных ионов. В КДПИ ионы и электроны поступают с поверхностей электродов с полумаксвелловскими функциями распределения по скоростям и движутся в межэлектродном промежутке без столкновений. КДПИ является хорошей моделью термоэмиссионного преобразователя энергии в кнудсеновском режиме [13] и Q -машины [14]. В [5] с помощью техники (η, ε) -диаграмм исследовалась модель Пирса, а в [6] изучались состояния плазмы в КДПИ на ионном фоне, соответствующем полностью самосогласованному стационарному решению задачи. В [9-12] эта же техника применялась в КДПИ для исследования решений на ионном фоне, который изменяется в ходе нестационарного ионного процесса. С помощью (η, ε) -диаграммы находились все электронные состояния и исследовалась их устойчивость относительно малых электронных возмущений. Если состояние оказывается неустойчивым, то в диоде развивается аperiodическая неустойчивость типа неустойчивости Пирса и происходит переход в одно из устойчивых состояний.

Применим технику (η, ε) -диаграмм для изучения состояний вакуумного диода с пучком электронов. Отсутствие ионного фона не вносит существенных изменений в эту технику. В случае $\delta > \delta_2$ для построения (η, ε) -диаграммы можно воспользоваться распределениями потенциала, полученными в предыдущем разделе. Для этого на рис. 2 проведем прямую $x = \delta$ и будем находить значения η в точках пересечения этой прямой с распределениями потенциала. Учитывая, что каждому распределению потенциала соответствует определенное значение ε_0 , получаем (η, ε) -диаграмму для зазора δ .

Зависимость η_δ от ε_0 можно построить аналитически. Для режимов с частичным и полным отражением она находится по формулам (19), (20) и (24) при $x = \delta$. Для режима без отражения явная зависимость η_δ от ε_0 приведена в Приложении. Отметим, что самосогласованные распределения потенциала при прохождении ионного пучка через плоский слой в отсутствие электронов изучались в [15]. Эта задача сводится к рассматриваемой нами задаче об электронном пучке, если изменить знаки у потенциала и напряженности. В [15] изучался режим без отражения с монотонными распределениями потенциала, а аналитические зависимости $\eta(x)$ были получены только для диапазона $-2^{3/2}/3^{1/2} \leq \varepsilon_0 \leq 0$.

Имея связь $\eta_\delta(\varepsilon_0)$, т.е. (η, ε) -диаграмму и учитывая то, что ток j однозначно связан с ε_0 , легко построить и вольт-амперную характеристику (ВАХ) диода — зависимость $j(\eta_\delta)$. На участке с частичным

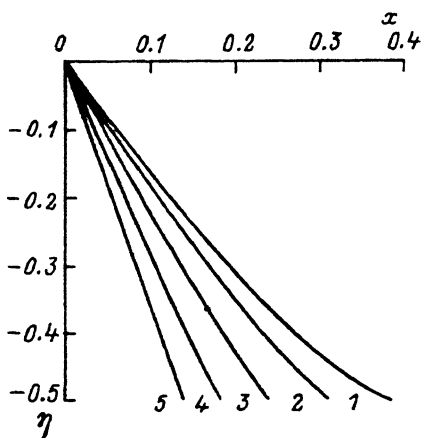


Рис. 3. Примеры распределений потенциала в режиме с частичным отражением электронов 2-го рода при $r = 0.5$.

1 — $\varepsilon_0 = \varepsilon_0^1 = 1.732$, 2 — $\varepsilon_0^1 + 0.2$, 3 — $\varepsilon_0^1 + 0.4$,
4 — $\varepsilon_0^1 + 0.8$, 5 — $\varepsilon_0^1 + 1.0$.

отражением электронов величина j изменяется в интервале 0.1 в соответствии с формулой (20) в случае без отражения $j \equiv 1$, а при полном отражении ток равен нулю.

В случае $\delta \leq \delta_2$ помимо найденных в разделе 1 решений могут существовать распределения потенциала с частичным отражением электронов другого типа, когда точка отражения находится непосредственно на коллекторе, т.е. $\eta_\delta = -1/2$. Такие решения будем называть распределениями потенциала с частичным отражением 2-го типа в отличие от решений с частичным отражением 1-го типа, у которых точка отражения лежит внутри зазора.

Обозначим связь между ε_0 и r для решений 1-го типа (формула (14)) через $\varepsilon_0^1(r)$. Зафиксируем $r < 1$ и будем строить $\eta(x)$ по параметрическим формулам (5), (8), (9). Если $\varepsilon_0 > \varepsilon_0^1(r)$, то с ростом x величина потенциала убывает и достигает значения $-1/2$ в точке $x^* < \delta_2$, причем $\varepsilon(x^*) > 0$. Продолжить решения за точку x^* нельзя, так как при этом $\eta(x)$ становится более отрицательным, что соответствует полному отражению и противоречит выбору $r < 1$. Если поместить коллектор в точке x^* , т.е. положить $\delta = x^*$, то получится решение с частичным отражением 2-го типа. На рис. 3 в качестве примера представлены распределения потенциала 2-го типа при $r = 0.5$ для ряда значений $\varepsilon_0 \geq \varepsilon_0^1(r)$. По пересечению этих кривых с прямой $\eta = -1/2$ можно найти зависимость δ от ε_0 . Таким графическим методом можно построить $\delta(\varepsilon_0)$ и для других r и найти функцию $\varepsilon_0(r)$ при фиксированном δ . Участок (η, ε) -диаграммы, соответствующий этим решениям, будет отрезком прямой $\eta = -1/2$.

Зависимость $\varepsilon_0(r)$ для решений 2-го типа можно найти и аналитически. Учитывая, что в точке отражения, которая в данном случае находится на коллекторе, скорость электрона обращается в нуль, т.е. $u(\delta) = 0$, из (9) находим выражение для ε_0 через τ_δ

$$\varepsilon_0 = \frac{1+r}{2} \tau_\delta + \frac{1}{\tau_\delta}. \quad (25)$$

Величина τ_δ находится из кубического уравнения, которое получается подстановкой (25) в (8). При его решении необходимо выбирать

положительный корень, для которого, кроме того, напряженность электрического поля на коллекторе неотрицательна. Такой корень оказывается единственным

$$\tau_\delta = 2 \left(\frac{2}{1+r} \right)^{1/2} \cos \left(\frac{\varphi + \pi}{3} \right), \quad \text{где} \quad \varphi = \arccos \left[3\delta \left(\frac{1+r}{2} \right)^{1/2} \right]. \quad (26)$$

Формулы (25), (26) имеют смысл только для $\delta \leq \delta_2$. При $\delta \leq \delta_1$ решения с частичным отражением второго типа существуют для всех r , а при $\delta_1 < \delta \leq \delta_2$ — только при $r \in (0, r^C)$, где

$$r^C = 2(\delta_1/\delta)^2 - 1. \quad (27)$$

Отметим, что при фиксированном δ величина ε_0 растет с ростом r .

3. Анализ (η, ε) -диаграмм и ВАХ

Существуют три значения δ (δ_1 , δ_2 и $2\delta_2$), при переходе через которые изменяется вид (η, ε) -диаграмм и ВАХ. На рис. 4 представлены характерные (η, ε) -диаграммы, а на рис. 5 — соответствующие ВАХ. Точками *A–E* на кривых отмечены границы областей, различающихся либо режимом прохождения электронов, либо характером устойчивости диода. При $\varepsilon_0 < \varepsilon_0^D$ (точка *D* на рис. 4 и 5) реализуется режим без отражения электронов и $j = 1$. При этом, когда $\varepsilon_0 \leq 0$, распределения потенциала монотонны и η_δ убывает с ростом ε_0 . При $0 < \varepsilon_0 < \varepsilon_0^D$ распределения потенциала, как правило, немонотонны. При $\varepsilon_0^D \leq \varepsilon_0 < \varepsilon_0^A$ (участок *DA* на рис. 4 и 5) реализуется режим с частичным отражением и ток убывает от 1 до 0 с ростом ε_0 . Области $\varepsilon_0 \geq \varepsilon_0^A$ соответствует режим с полным отражением, в котором $j = 0$; здесь η_δ всегда убывает с ростом ε_0 .

Рассмотрим подробнее (η, ε) -диаграммы для разных величин зазора. При $\delta \geq \delta_2$ (рис. 4, *a, б*) величина ε_0^D не зависит от δ и равна $2^{1/2}$. В этом случае значение потенциала η_δ^D , соответствующее ε_0^D , находится из (19) при $j = 1$

$$\eta_\delta^D = 2 \left[\frac{3}{4}(\delta - \delta_2) \right]^{4/3} - \frac{1}{2}. \quad (28)$$

В режиме без отражения электронов зависимость η_δ от ε_0 немонотонна и принимает минимальное значение в точке *E*; в этом режиме участок (η, ε) -диаграммы описывается формулами (П.4)–(П.6), (5) и (9). Для построения участка диаграммы *DA*, отвечающего частичному отражению, используются формулы (19) и (20). Переход к режиму с полным отражением происходит при $\varepsilon_0 = \varepsilon_0^A = 2$, а диаграмма на этом участке строится по формулам (22)–(24).

При $\delta < \delta_2$ на (η, ε) -диаграмме внутри области *DA* появляется участок, отвечающий режиму с частичным отражением 2-го типа (рис. 4, *в, г*). Для $\delta_1 \leq \delta < \delta_2$ этот режим реализуется при $\varepsilon_0^D < \varepsilon_0 < \varepsilon_0^C$

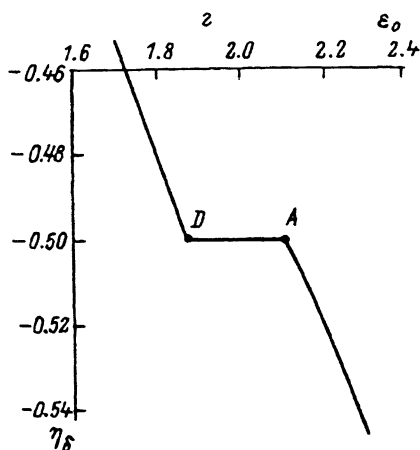
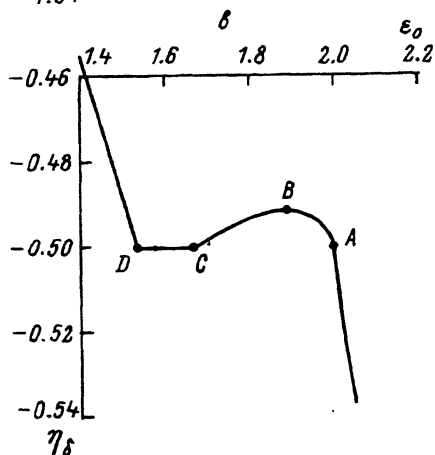
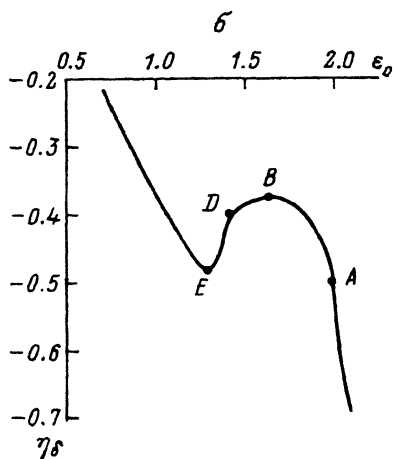
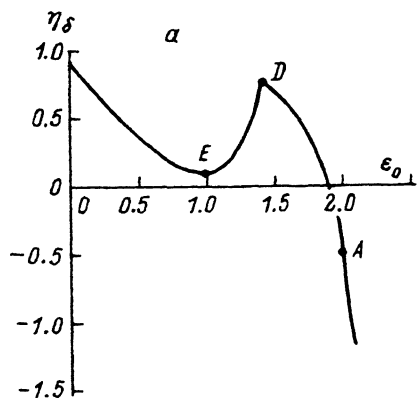


Рис. 4. Примеры (η, ϵ) -диаграмм для разных величин зазора, а — $\delta = 3 \cdot \delta_2$, б — $1.3 \cdot \delta_2$, в — $1.2 \cdot \delta_1$, г — $0.9 \cdot \delta_1$.

(отрезок прямой с $\eta_\delta = -1/2$ на рис. 4, в). Значение ϵ_0^D находится из формул (25), (26) при $r = 0$, а ϵ_0^C — из формул (27) и (14)

$$\epsilon_0^C = 2 \cdot \delta_1 / \delta. \quad (29)$$

С уменьшением δ участок CA , отвечающий решениям с частичным отражением первого типа, сокращается и при $\delta = \delta_1$ исчезает. При $\delta < \delta_1$ весь участок DA (рис. 4, г) соответствует решениям второго типа, а ϵ_0^A находится из (25) и (26) при $r = 1$.

Описанная выше классификация различных режимов диода наглядно представлена на рис. 6, где на плоскости ϵ_0, δ изображены границы областей с решениями различного типа. Здесь вертикальные пунктирные линии соответствуют примерам из рис. 4 и 5 ($\delta = 3 \cdot \delta_2, 1.3 \cdot \delta_2, 1.2 \cdot \delta_1$ и $0.9 \cdot \delta_1$). Решения с частичным отражением на рис. 6 лежат в полосе, ограниченной сверху линиями 1 и 3, а снизу — линиями 2 и 6. Ниже этой полосы реализуются состояния без отражения, выше — с полным

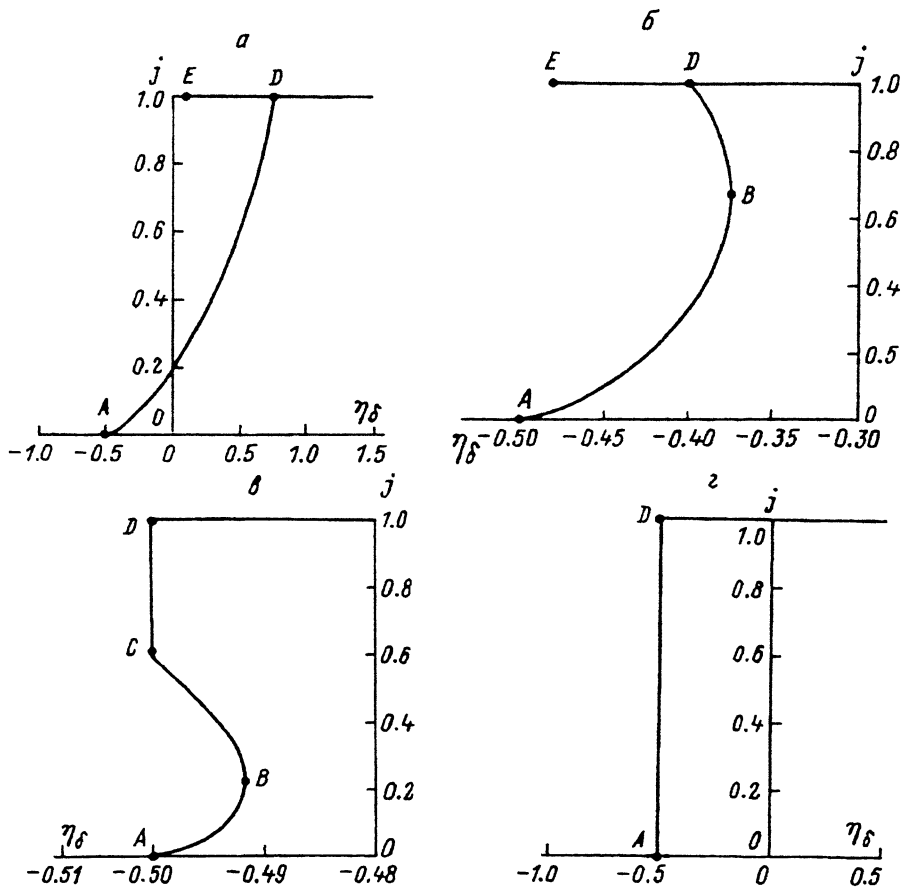


Рис. 5. Примеры ВАХ диода для разных величин зазора (значения δ те же, что и на рис. 4).

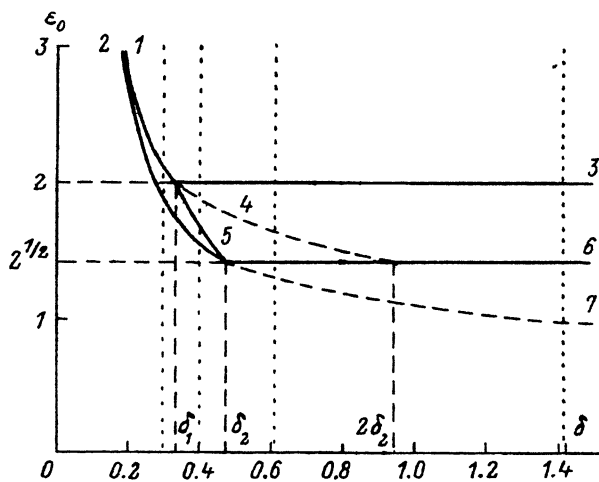


Рис. 6. Области существования решений различного типа на плоскости ϵ_0, δ .

отражением. Внутри этой полосы правее линии 5 лежат решения с частичным отражением 1-го, а левее — 2-го типа.

Приведем сводку формул, описывающих границы областей, показанных на рис. 6 сплошными линиями: линия 1 описывается формулами (25), (26) при $r = 1$, $0 \leq \delta \leq \delta_1$; линия 2 — (25), (26) при $r = 0$, $0 \leq \delta \leq \delta_2$; линия 3 — $\varepsilon_0 = 2$, $\delta_1 \leq \delta < \infty$; линия 5 — (29), $\delta_1 \leq \delta \leq \delta_2$; линия 6 — $\varepsilon_0 = 2^{1/2}$, $\delta_2 \leq \delta < \infty$.

4. Исследование устойчивости

Используя (η, ε) -диаграмму, можно исследовать диод на устойчивость [5-7]: устойчивому состоянию соответствует $d\eta_\delta/d\varepsilon_0 < 0$, в неустойчивом состоянии $d\eta_\delta/d\varepsilon_0 > 0$.

а) В режиме без отражения ($r = 0$) производная $d\eta_\delta/d\varepsilon_0$ находится с использованием формул (5), (8) и (9)

$$\frac{d\eta_\delta}{d\varepsilon_0} = \frac{d\eta_\delta}{du_\delta} \frac{du_\delta}{d\tau_\delta} \frac{d\tau_\delta}{d\varepsilon_0} = \frac{\tau_\delta^3}{6} - \delta. \quad (30)$$

На границе устойчивости (точка E на рис. 4, а, б; 5, а, б) время пролета электрона через зазор τ_δ^E равно $(6\delta)^{1/3}$, а ε_0^E и η_δ^E находятся из (8), (5) и (9)

$$\varepsilon_0^E = \left(\frac{4}{3\delta} \right)^{1/3}, \quad (31)$$

$$\eta_\delta^E = \frac{1}{2} \left\{ \left[\left(\frac{\delta}{\delta_2} \right)^{2/3} - 1 \right]^2 - 1 \right\}. \quad (32)$$

Решения устойчивы для $\varepsilon \in (-\infty, \varepsilon_0^E)$ и неустойчивы для $\varepsilon_0 \in (\varepsilon_0^E, 2^{1/2})$ (участок ED на рис. 4, а, б). На рис. 6 граница устойчивости в режиме без отражения (31) показана штриховой линией 7.

Формулы (31), (32) имеют смысл только при $\delta \geq \delta_2$. При $\delta < \delta_2$ участок (η, ε) -диаграммы для решения без отражения электронов $\varepsilon_0 \in (-\infty, \varepsilon_0^D)$ монотонен (рис. 4, в, г) и все такие состояния устойчивы (точка E на рис. 4, в, г отсутствует).

б) Для режима с частичным отражением 1-го типа параметры границы устойчивости η_δ^B , ε_0^B и j_B (точка B на рис. 4, б, в; 5, б, в) находятся из условия $d\eta_\delta/d\varepsilon_0 = 0$ с использованием формул (19), (20)

$$\eta_\delta^B = \frac{1}{2} \left\{ \left[(3\delta)^{2/3} - 1 \right]^2 - 1 \right\}, \quad (33)$$

$$\varepsilon_0^B = 2 \cdot (3\delta)^{-1/3}, \quad (34)$$

$$j_B = 2 \cdot [1 - (3\delta)^{-2/3}]. \quad (35)$$

Состояния, лежащие правее точки B , устойчивы (участок BA на рис. 4, б и в), а левее нее — неустойчивы (участок DB на рис. 4, б и

CB на рис. 4, θ). На рис. 6 граница устойчивости в режиме с частичным отражением 1-го типа, рассчитанная по (34), показана штриховой линией 4. Выше этой линии состояния диода устойчивы.

Отметим, что формулы (33)–(35) имеют смысл только при $\delta \in \in [\delta_1, 2\delta_2]$. При $\delta > 2\delta_2$ участок (η, ε) -диаграммы, соответствующий решениям с частичным отражением (участок DA на рис. 4, a), монотонен и все такие состояния устойчивы. При $\delta < \delta_1$ решения с частичным отражением 1-го типа отсутствуют. При $\delta = \delta_1$ точка B совпадает с точкой A , а при $\delta = 2\delta_2$ — с точкой D .

в) В режиме с частичным отражением 2-го типа $d\eta_\delta/d\varepsilon_0 \equiv 0$. В этом случае для определения характера устойчивости состояний требуется более детальный учет разброса по скоростям у электронов.

г) В режиме с полным отражением производная $d\eta_\delta/d\varepsilon_0$, определяемая с использованием формул (22)–(24), всегда отрицательна и все такие состояния устойчивы.

5. Обсуждение результатов. Бинарные состояния

При рассмотрении (η, ε) -диаграмм (рис. 4) обращает на себя внимание то, что зависимость η_δ от ε_0 , как правило, является немонотонной. Эта немонотонность приводит к тому, что для любого $\delta > \delta_1$ существует интервал внешних напряжений $(\eta_\delta^{\min}, \eta_\delta^{\max})$, в котором одному η_δ отвечают три разных значения ε_0 , т.е. три состояния с различающимися распределениями потенциала. Из рис. 4 следует

$$\eta_\delta^{\min} = \begin{cases} -1/2 & \delta_1 \leq \delta \leq \delta_2 \quad (\text{рис. 4, } \theta), \\ \eta_\delta^E & \delta \geq 2\delta_2 \quad (\text{рис. 4, } a, \delta), \end{cases}$$

$$\eta_\delta^{\max} = \begin{cases} \eta_\delta^B & \delta_1 \leq \delta \leq 2\delta_2 \quad (\text{рис. 4, } \theta, \theta), \\ \eta_\delta^B & \delta \geq 2\delta_2 \quad (\text{рис. 4, } a). \end{cases}$$

Зависимости η_δ^{\min} и η_δ^{\max} от δ (кривые 1 и 2 на рис. 7) определяют границы области неоднозначности на плоскости η_δ, δ . Заметим, что при $\eta_\delta = 0$ неоднозначность имеет место для $2\delta_2 \leq \delta \leq 4/3$, что совпадает с результатами [1] (рис. 1).

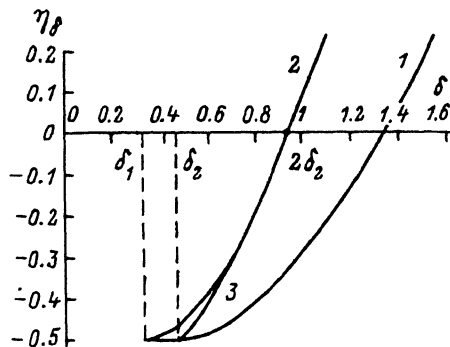


Рис. 7. Области существования нескольких состояний на плоскости η_δ, δ .

Можно выделить два типа неоднозначностей. Если $\delta \geq 2\delta_2$ (рис. 4,а), то η_δ , лежащим в интервале $(\eta_\delta^E, \eta_\delta^D)$, отвечают два состояния без отражения (устойчивое состояние с меньшим ϵ_0 и неустойчивое — с бóльшим) и одно устойчивое состояние с отражением электронов — первый тип неоднозначности. При $\delta_2 < \delta < 2\delta_2$ (рис. 4,б) в интервале $\eta_\delta \in (\eta_\delta^E, \eta_\delta^D)$ сохраняется первый тип неоднозначности, а в интервале $\eta_\delta \in (\eta_\delta^D, \eta_\delta^B)$ возникает второй тип неоднозначности: одно устойчивое состояние без отражения и два с отражением электронов (неустойчивое с меньшим ϵ_0 и устойчивое — с бóльшим). При $\delta_1 < \delta \leq \delta_2$ остается только неоднозначность второго типа. На рис. 7 граница между этими типами неоднозначности показана линией 3.

Из проведенного выше рассмотрения видно, что в области неоднозначности существуют два устойчивых решения, т.е. в вакуумном диоде с моноэнергетическим пучком электронов реализуются бинарные состояния. Пороговое значение зазора, при котором возникает это явление, равно $\delta_1 = 1/3$.

В общем случае будем называть бинарными состояниями в вакуумном или плазменном диодах такие состояния, когда при одном потенциале коллектора имеются два устойчивых относительно малых электронных возмущений полностью самосогласованных решения. Заметим, что в КДПИ также могут существовать несколько устойчивых электронных состояний [6,9-12]. При развитии неустойчивости Пирса за время порядка времени пробега электронов через зазор диод переходит в одно из этих состояний (распределение ионов за это время не меняется). Однако результирующее состояние не является согласованным с распределением ионов; в дальнейшем за время порядка времени пробега ионов через зазор происходят перераспределение ионов и перестроение потенциала. В отличие от КДПИ в вакуумном диоде, где ионы отсутствуют, найденные решения являются полностью самосогласованными.

Рассмотренное явление неоднозначной зависимости ϵ_0 от η_δ в вакуумном диоде приводит к гистерезису на ВАХ диода. Рассмотрим для примера случай $\delta_1 \leq \delta \leq \delta_2$ (рис. 4,б и 5,б). Приложим к диоду напряжение и будем увеличивать его со стороны отрицательных значений. Когда η_δ превысит значение $-1/2$, через диод потечет ток, возрастая с увеличением η_δ . В точке В (рис. 5,б) ток скачком изменяется до значения, равного 1 (режим с частичным отражением сменяется режимом без отражения), и при дальнейшем увеличении η_δ перестает изменяться. При обратном ходе (при уменьшении η_δ) ток диода остается равным 1 пока не достигнет точки Е. После этого происходит скачкообразное уменьшение тока: из режима без отражения диод переходит в режим с частичным отражением.

Таким образом, подробная классификация всех возможных распределений потенциала, (η, ϵ) -диаграмм и ВАХ в вакуумном диоде с электронным пучком позволила исследовать устойчивость всех решений, определить область, в которой возникает неустойчивость Бурсиана и найти область существования бинарных состояний.

Если в дальнейшем несколько стационарных состояний удастся обнаружить и в плазменных диодах, то это, несомненно, будет иметь важное прикладное значение.

Построение зависимости η_δ от ε_0 в режиме без отражения

Полагая в (8) $x = \delta$ и $r = 0$, получаем следующее кубическое уравнение для τ_δ :

$$\tau_\delta^3 - 3\varepsilon_0\tau_\delta^2 + 6\tau_\delta - 6\delta = 0. \quad (\text{П.1})$$

Его дискриминант имеет вид

$$D(\delta, \varepsilon_0) = 9\delta^2 + 6\varepsilon_0(\varepsilon_0^2 - 3)\delta - 3\varepsilon_0^2 + 8. \quad (\text{П.2})$$

В зависимости от знака дискриминанта уравнение (П.1) имеет один ($D > 0$) или три ($D < 0$) вещественных корня. Нужный корень выбирается с использованием следующих условий: величина τ_δ должна быть положительна, а зависимость x от τ (формула (8) при $r = 0$) — монотонна на участке $\tau \in (0, \tau_\delta)$.

На рис. 8 показаны четыре области на плоскости (ε_0, δ) , которые различаются по числу и характеру корней уравнения (П.1). Здесь сплошные линии 1-4 соответствуют $D = 0$, а штриховая линия 5 — $\varepsilon_0 = 2^{1/2}$ при $\delta \in (\delta_2, \infty)$. Приведем сводку формул для нахождения τ_δ с учетом сформулированных выше условий.

1) Область между линиями 1 и 2 на рис. 8 ($D < 0$)

$$\tau_\delta = -2|p|^{1/2} \cos\left(\frac{\pi - \varphi}{3}\right) + \varepsilon_0, \quad (\text{П.4})$$

где $p = 2 - \varepsilon_0^2$, $q = -\varepsilon_0^3 + 3\varepsilon_0 - 3\delta$, $\varphi = \arccos(-q/|p|^{3/2})$.

2) Область ниже кривой 3 на рис. 8 ($D < 0$)

$$\tau_\delta = 2|p|^{1/2} \cos\left(\frac{\varphi}{3}\right) + \varepsilon_0. \quad (\text{П.5})$$

3) Область между линиями 2, 5 и 3 на рис. 8 ($D > 0$)

$$\tau_\delta = \left(-q + D^{1/2}\right)^{1/3} + \left(-q - D^{1/2}\right)^{1/3} + \varepsilon_0. \quad (\text{П.6})$$

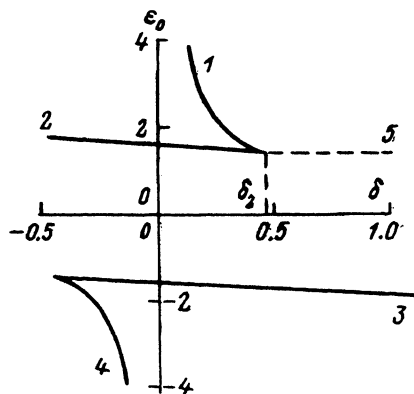


Рис. 8. Области постоянства знака дискриминанта D .

4) В области выше линий 1 и 5 ($D > 0$) решений не существует.

Определив τ_ϵ , из уравнений (9), (5) при $r = 0$ находим η_δ , т.е. получаем зависимость $\eta(\delta, \epsilon_0)$.

Как отмечалось в разделе 2, в [15] изучались самосогласованные монотонные распределения потенциала в вакуумном диоде с пучком заряженных частиц, движущихся без отражения. Для потенциала η было получено кубическое уравнение, дискриминант которого D_1 связан с D (формула (П.2)) следующим образом: $D_1(x, \epsilon_0) \sim [D(x, \epsilon_0)]^3 \cdot (x - \epsilon_0 + \epsilon_0^3/3)$. Аналитические зависимости $\eta(x)$ в [15] были получены только для таких $\epsilon_0 \leq 0$, когда $D_1 > 0$ при всех $x > 0$.

Список литературы

- [1] Бурсиан В., Павлов В. // Журн. рус. физ.-хим. общества. 1923. Т. 55. Вып. 1-3. С. 71-80.
- [2] Незлин М.В. Динамика пучков в плазме. М.: Энергоиздат, 1982. 263 с.
- [3] Добрецов Л.Н., Гомоюнова М.В. Эмиссионная электроника. М.: Наука, 1966. 564 с.
- [4] Pierce J.R. // J. Appl. Phys. 1944. Vol. 15. N 10. P. 721-726.
- [5] Смирнов В.М. ЖЭТФ. 1966. Т. 50. Вып. 4. С. 1005-1012.
- [6] Кузнецов В.И., Эндер А.Я. // ЖТФ. 1977. Т. 47. Вып. 11. С. 2237-2246.
- [7] Norris W.T. // J. Appl. Phys. 1964. Vol. 35. N 11. P. 3260-3268.
- [8] Godfrey B.B. // Phys. Fluids. 1987. Vol. 30. N 5. P. 1553-1560.
- [9] Кузнецов В.И., Эндер А.Я. // ЖТФ. 1979. Т. 49. Вып. 10. С. 2176-2179.
- [10] Кузнецов В.И., Эндер А.Я. // ЖТФ. 1981. Т. 51. Вып. 11. С. 2250-2259.
- [11] Кузнецов В.И., Эндер А.Я. // ЖТФ. 1983. Т. 53. Вып. 12. С. 2329-2338.
- [12] Кузнецов В.И., Эндер А.Я. Препринт ФТИ АН СССР. № 1061. Л., 1986.
- [13] Hatzopoulos G.N., Gyftopoulos. Thermionic Energy Conversion. Vol. I. Processes and Devices. Vol. II. Theory, Technology and Application. MIT Press (Cambridge, MA and London), 1973, 1979.
- [14] Motley R.W. Q-machines. New York; San Francisco; London: Academic Press, 1975.
- [15] Farouki R.T., Dalvie M., Pavarino L.F. // J. Appl. Phys. 1990. Vol. 68. N 12. P. 6106-6116.

